PAT-NO:

JP355125681A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 55125681 A

TITLE:

MANUFACTURE OF PHOTOVOLTAIC

DEVICE

PUBN-DATE:

September 27, 1980

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

KUWANO, YUKINORI

IMAI, TERUTOYO

UMETANI, MASAKAZU

NAKANO, SHOICHI

INT-CL (IPC): H01L031/04

US-CL-CURRENT: 136/249, 136/258

ABSTRACT:

PURPOSE: To enable low temperature treatment and mass production of a photovoltaic device by employing a plasma reaction upon formation of an amorphous silicon layer and a transparent electrode layer on a substrate when forming a generating region by laminating the amorphous silicon layer and the electrode layer.

CONSTITUTION: First to fourth reaction chambers 22a∼ 22d communicating through partition wall doors 26a∼ 26c are formed in an apparatus for fabricating a photovoltaic device, and a heater 33 and opposite electrodes 27, 28 connected to a high frequency power supply 31 are arranged in the respective reaction chambers. Thus, the photovoltaic device is formed, glass substrates 7 placed on a belt conveyor 23 are passed through the reaction chambers sequentially, and first transparent SnO<SB>2</SB> electrodes 12 having predetermined interval are formed on the substrate 7 by a plasma generated between the electrodes 27 and 28 in the reaction chamber 26a. Then, an amorphous silicon layer 11 having a p-type layer 11a, a undoped layer 11b and an n-type layer 11c is similarly coated on the entire surface thereof in the reaction chamber 26b, and passed through the reaction chambers 22c and 22d to grow similarly a second aluminum electrode 13 and an SiO<SB>2</SB> protective film 50 thereon.

COPYRIGHT: (C) 1980, JPO&Japio

(19 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭55-125681

⑤Int. Cl.³H 01 L 31/04

識別配号

庁内整理番号 6655--5F ❸公開 昭和55年(1980)9月27日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

砂光起電力装置の製造方法

②特 顧 昭54-33919

②出 願 昭54(1979)3月22日

⑩発 明 者 桑野幸徳

守口市京阪本通2丁目18番地三

洋電機株式会社内

切発 明 者 今井照豊

守口市京阪本通2丁目18番地三

洋電機株式会社内

@発 明 者 梅谷雅和

守口市京阪本通2丁目18番地三

洋電機株式会社内

@発 明 者 中野昭一

守口市京阪本通2丁目18番地三

洋電機株式会社内

⑩出 願 人 三洋電機株式会社

守口市京阪本通2丁目18番地

2

明細

1, 発明の名称 光起電力装置の製造方法

2. 特許耐求の範囲

(1) 基板上に、光照射により発電に寄与する電子及び又は正孔を発生する非晶質シリコン層と透明電極層とを少なくとも積層してなる光起電力装置において、上記非晶質シリコン層と透明電極層はブラズマ反応により形成されることを特徴とする光起電力装置の製造方法。

3、 発明の詳細な説明

本発明は光起電力装置の製造方法に関する。

太陽域池や光検出場のような光起戦力製盤は太 脳光線を直接電気エネルギに変換することができ るが、この種装成の最大の問題として、他の電気 エネルギ発生手段と比較して発電費用が極めて大 きいことが目われている。その主な原因は、装置 の主体を構成する半導体材料の利用効率が低いこ と、更には斯る材料を製造するに要するエネルギ が多いことにある。

ところが、最近、との様を欠点を一毎に解決す

る技術として、上記半導体材料に非晶質シリコンを使用することが提案された。即ち非晶質シリコンはシランやフロルシリコンなどのシリコン化合物雰囲気でのです。 によって安価かっ大量に形成することができ、その場合の非晶質シリコン(以下GDー881と略記する)では、禁止帯の幅中の平均局在状態密度が10¹⁷cs⁻³以下と小さく、結晶シコンと同じ様にP型、N型の不純物制御が可能となるものである。

第1図は上記の点に鑑み既に提案された光起電力装置を示し、(7)は可視光透過可能なガラスなどからなる平担な絶縁基板、(8)、(9)、四は該絶縁基板上に旋状に形成された第1、第2、第3の発電区域である。該発電区域の各々はGD-a81層回と該層を挟んで対向する第1電極四及び第2電極四から構成されている。

QD-aBiMiDは蓋板(7例から順次堆積されたP型M(11a)、ノンドーブM(11b)及びM型M(11c)の 3 個からなり、斯るQD-aBiMiDは第1~第3

の発地区域に連続して延びている。 GD-a 81 型 凹を繰成する上記各層において、 P型間は膜厚40~1000Å、 ドープ量 Q 0 1~1 多、 ノンドープ 間は膜厚 Q 5~2 μm、 B型間は膜厚 2 0 0~1 0 00Å、 ドープ量 Q 1~3 まであり、各種の形成 温度は 2 0 0~4 0 0℃である。

第1電磁路は可視光透過性を有し、酸化錫、酸化インジウム、酸化インジウム・錫(IngOs+x8nOs、x≤Q1) などで構成することができる。第2 電磁路はアルミニウム、クロムなどで構成される。

第1~第3発館区域(B)~00の夫々の第1電極的及び第2館極間は基板(7)上において夫々の発電区域の外へ延びる延長部の及び個を有し、第1発電区域(B)の第1電極間の延長部のとか、又第2発電区域(B)の第1電極間の延長部のとが夫々互いに重量して電気的に接続されている。又第1発電区域(B)の第1電極間の延長部のには第2電極間と同材料からなる接続部のが重量被費されている。

5

し、30は、第1~第3の隔壁(21a)~(21c)によ りその内部が婚1~第4の反応室(22a)~(22d) に分離されてなる反応質、四は第1~第4の反応 室 (22a)~(22d) 内を賞通移動するステンレス製 のペルトコンペア、匈及び匈は夫々反応管匈の入 口及び出口を開閉する入口扉及び出口扉で、各扉 はペルトコンペア四を境に上下に開放移動する。 (26a)~(26c) は失々第1~第3の隔壁(21a)~ (21c)のペルトコンペア四通過口を崩閉する第1 ~第3階壁扉で、これらは上記入口扉の、出口扉 図と同様に動作する。例及び図は各反応室(22a) ~(224) に対向配置された、第1、第2の反応電 極で、各電極は線四、切を介して高周波発振原印 に速なつている。@は第3反応室 (22c)のダ1反 応道極切に固着されたアルミニウム基体である。 図は第2反応電極図の下に配されたヒータ、(34a) ~(544) は夬々、第1~第4反応室(22a)~(22d) 内に操作を施すための第1~第4ハツチ、四は排 気パルプで、核パルプを聞くことにより各反応室 (22a)~(22a) 内の俳気がなされる。例は第1パ

上記数盤において、基板の及び第1曜を図を介して光がGD-a81階回に入ると、主にノンドーブ階(11b)において自由状態の電子及び又は正孔が発生し、これらは上記各層の作るPIN接合電界により引かれて移動した後、第1電極圏や第2電極圏に築められ両電極間に截圧が発生する。このとき各区域の第1、第2電極圏、個はその延長部において交互に接続されているので各区域の起電圧は置列に相加され、第1発電区域側に連なる接続部級を+極、第3発電区域側の第2電極圏に連なる延長部級を一極として両極の間に上記の如く相加された電圧が発生する。

向上記袋世において第1 電極的に連なる延長部 (以には電極材料の性質により外部リード線を超音 彼ボアンディングなどにより接続するのが困難で あるが、接続部頃の存在はこれを容易になすもの である。

本発明は上記装置をより量率的に製造する方法を提供するものである。

第2図は本発明方法を実施するための装置を示

ルブで、抜パルブを開くことにより第1反応室 (22a)に (BnCl4+01)ガスを供給することができ

る。例~倒は夫々第2~第4パルブで、該パルブを開くととにより第2反応室 (22b)に失々 81k4・B2K4・PK5 の各ガスを供給することができる。仰は第5パルブで、該パルブを開くことにより Ar ガスを第3反応室 (22c)に供給することができる。仰は第6パルブで、該パルブを開くことにより

(81H₄+0₂) ガスを第 4 反応室 (22d) に供給する ととができる。

第3図は上記製造装置により製造された光起電力装置を示し、その保造は、第2電低四表面に 810g からなる絶縁性保護膜的が更に形成されている点を除いて第1図の保造と同一であり、同一番号が付されている。

さて第2図において、各反応室(22a)~(22d) 内のベルトコンペア総上には製造途中の光起電力 短峰(51a)~(51d) が戦置されている。即ち、第 1 反応室(22a)内の装置(51a)は第3図に示す基 板(7)のみであり、第2反応室(22p)内の装置(51b) は同じく基板(のと取り電低のとからなり、第3反応室 (22a)内の装置 (51a)は同じく基板(7)、第1 電極四及び GD-a81 層四からなり、第4反応室 (22a)内の装置 (51a)は同じく基板(7)、第1 単極四、 GD-a81 層四及び第2電路のからなるものである。

しかして、第1反応室(22a)では第1億極02の 形成、第2反応室(22a)ではGD-a81億四の形成、 第3反応室(22a)では第2億種03の形成、第4反 応室(22a)では保護機関の形成が失々なされ、と れらの形成は各反応室において平行して行なわれる。

各反応室(22a)~(22a)での反応が開始されるに当り、ベルトコンペア四は停止しており、各袋 置(51a)~(51a)は第1、第2反応電極の、四の間に位置し、又入口原四、出口原四及び第1~第3所歴原(26a)~(26c)は全て閉じた状態にある。第1反応室(22a)では、まず基板(7)上に第1電極四形成用のマスクが載置される。新る作業は第1ハツチ(54a)を介して行なわれる。次に排気バ

ルプ四により第1反応室(22a)内を排気した後第 1 パルプ間により該室内に BnC 14 + 0 2 ガスが導入 される。又ヒータ四により基板のが 3 0 0 ℃に加 熟され、新る状態で両周波電源四より第1、第2 反応電極四、四間に高周波電圧が印加されると両 電極間でプラズマ反応が生じ、 BnO 2 (酸化錫) が上記マスクに応じて基板の上に堆積し、透明な 第1電極四が形成される。尚、第1電極四の電気 伝導度を良くするために上記プラズマ雰囲気に BDC 15 ガスを添加することもできる。

第2反応室(22b)では、第1 地位間を有する基板の上に GD-a81層間形成用のマスクが報報される。 斯る作業は第2ハッチ(34b)を介して行なわれる。 次に同様に第2反応室(22b)内を排気した後、第2、第3パルブ節、傍により眩室内に515gが大と B2 E4がスが導入され、又ヒータ際により基板のが 300℃に加熱される。 新る状態で同様に第1、第2反応電極の、傾間に高周波電圧が印加されると両電極間でプラズマ反応が生じ、 GD-a8iのP型層(11a)が上記マスクに応じて基板の

9

上に地殺する。その後第2反応室(22b)を再び排気した後、同様に81H4 ガスのみを該室内に導入しプラズマ反応を起こすと上記P型層(11a)上にGD-a81のノンドーブ層(11b)が地級形成される。 最後に、第2反応室(22b)に第4パルブ倒より PH1 ガスを導入し、既に存在せるB1H4 ガスとの 混合雰囲気となし、プラズマ反応を起こすと上記 ノンドーブ層(11b)上にGD-a81個個の形成が完了す

第3反応室(22e)では、GD-a81脳山上に第2 電極個形成用マスクが戦望される。斯る作業は第 3ハッチ(34e)を介して行なわれる。次に同様に 第3反応室(22e)内を排気した後、第5パルブ畑 により該室内にAr ガスが導入され、又ヒータ四 により弦板(7)が150℃に加熱される。斯る状態 で第1、第2反応電極の、四間に両周破電圧が印 加されるとブラズマスパッタ反応によりアルミニ タム基体四よりアルミニタム原子がスパッタされ それが上記マスクに応じてGD-a81脳印上に被殺 し、斑2雌磁切が形成される。

邓4反応室(22a)では第2地極四上に保護膜例 形成用マスクが戦闘される。斯る作業は第4ハッチ(34a)を介して行なわれる。次に同様に第4反応室(22a)内を排気した後、第6パルブ仰により 被室内に(81E4+02)がスが導入され、又ヒータ 頃により基板(7)が150℃に加熱される。斯る状態で第1、第2地極例、関間に商周波電圧が印加されるとブラズマ反応により8102が上記マスクに応じて第2地極四上に地費され、保護原列が形成される。

尚、上紀各マスクは第1、第2電極の、図の各 延長部(M、四及び接続部份の形成をも同時に行な うものである。即ち、延長部(Mは第1反応室(22a) で第1電極(Mと同時形成され、延長部份及び接続 部(Mは第3反応室(22c)で第2電極(Mと同時形成 される。

さて上記各反応室での反応が終了すると、各反応室を排気した後、第1~第3隔壁扉(26a)~(26o)を聞き、次いで第5パルブ仰によりAr ガスを導

10

- 特別的55-125681(4) る。所る接位にあつては光は透明電極的を介して GD-a81層砂に入り、透明電極的と蒸板切との間

に光起戦圧が発生する。

第4図の袋屋を本発明により製造する場合、第2図の製造袋底において、第1、第2反応室(22a)(22b)のみが使用され、ペルトコンペア図は第2反応室(22a)に向つて移動し、各反応室での反応は第2図の場合と同様にして行なわれる。

以上の説明より明らかな如く本発明によれば、 非晶質シリコン層と透明電磁を共化プラズマ反応 により形成することにより光起電力装置を比較的 低温で容易に量度することができる。

4, 図面の簡単な説明

第1図本は本発明の対象とする光銀電力装置の平面図、第1図B及びCは失々第1図本におけるB-B及びC-C断面図、第2図は本発明を実施するための製造装置の断面図、第3図は本発明実施例により得られた装置の断面図、第4図は本発明他の実施例により得られた装置の断面図である。

入する。 とれにより各反応室 (22a)~(22d) に AT ガスが描され、その圧力が大気圧になったところで各ハッチ (34a)~(34d)を介して上配各マスクを引上げると共に入口原路及び出口原路を開放する。次いでベルトコンペア器を所定距離だけ出口 配数方向に動かし、各装健 (51a)~(51d)を次段の第1、第2反応電極節、公間に位置せしめ、入口原料、出口肺器及び第1~第3隔壁扉 (26a)~(26c)を閉じる。 析る状態で再び上配各反応室での反応が開始される。

使つて、ベルトコンペア四の移動と共化、反応 管四入口側に次々と新して基板切を軟置し、各反 応室での反応を行なえば反応管四出口側より次々 と完成した光起電力装置が得られる。

上記実施例は基板(のにガラス製のものを用いたものであるが、金属製のものを用いることもできる。 第4図はこの場合の完成された光起電力装置を示し、例は金属製基板、間はN型層(61c)よりなるGD ンドーブ阀(61b)及びP型層(61c)よりなるGD -a81層、図は該層上に形成された透明電極であ

13

(7)…基板、如… GD-a81層、似…透明電極。

特 許 出 願 人 三洋電機株式会社 代製者 井 植 解





